LHD重水素プラズマにおける 7**P**37 ICRF加熱時のノックオンテイル観測実験

Knock-on tail observation experiment during ICRF heating in deuterium plasma of large helical device

○梅﨑大介¹, 松浦秀明¹, 木村建斗¹, 福田理仁¹,

小川国大2,3, 磯部光孝2,3, 神尾修治4, 川本靖子2, 大石鉄太郎2,3

OUMEZAKI Daisuke¹, MATSUURA Hideaki¹, KIMURA Kento¹, FUKUDA Takahito¹,

OGAWA Kunihiro^{2,3}, ISOBE Mitsutaka^{2,3}, KAMIO Shuji⁴, KAWAMOTO Yasuko², OISHI Tetsutarou^{2,3}

1九大院工, 2核融合研, 3総研大, 4カリフォルニア大学アーバイン校

¹Kyushu Univ., ²NIFS, ³SOKENDAI, ⁴UCI

【研究背景・目的】

高エネルギーイオンの大角度散乱過程として、核弾性散乱が知 られている[1]。核弾性散乱は核力を介した散乱であり、小角度散 乱が支配的なクーロン散乱に比べて、一度の散乱で大きなエネル ギーが輸送される。NBI で生成された高エネルギー陽子が、核弾 性散乱を介して重陽子速度分布関数上に高エネルギーテイル(ノ ックオンテイル)を生じ、中性子発生率が1桁程度上昇すること が LHD における実験で確認されている[2]。本研究では、LHD において、高電子温度下($T_e(0) \approx 10 \text{ keV}$)の ICRF 入射前後で、 イオン温度・電子密度の変化量からは説明が難しい中性子発生率 の上昇を確認した。DNPA[3]から ICRF 高エネルギー陽子の量を 推測し、核弾性散乱を介したノックオンテイル形成の可能性を検 討した。

【観測・解析結果】

中性子発生率の増加が見られた複数のショットは、①低イオン 温度・高電子密度、②高イオン温度・低電子密度の2種類に大別 できる。図1に代表的なショット波形例を示す。3.5sで NBI#5(D)を入射し、CXSを用いてイオン温度を計測している。 NBI#5(D)由来の中性子発生率が十分に減少してから、ICRF を入 射した。イオン温度が減少しているにも関わらず、2~4倍程度 の中性子発生率の増加が観測されている。理論中性子発生率はイ オン温度に伴って急激に減少するため、時間経過に伴う密度の増 加では説明が難しいと考えられる。

ICRF 及び NBI 同時入射の NPA カウントから、NBI のみを入 射したときのカウント数を引くことで、純粋な ICRF 由来の高エ ネルギー陽子量を推測した(図 2)。90~180 keV 付近では、吸収 パワー1.8 MWのNBI#3(H)と同程度の、180 keV以上ではNBI より顕著に多い高エネルギー陽子が存在したと考えられる。 Boltzmann-Fokker-Planck (BFP)方程式[4]を解くことで、重陽



172491

NBI#1(H)

D 172058

NBI#5(D)



陽子の量の推測

子の速度分布関数を求めた。発表ではノックオンテイル形成の可能性を解析の面から議論する。電子 温度が高く(T_e(0) ≈ 10 keV)、高エネルギー陽子が NBI#3 と同程度存在することなど、ノックオンテ イル形成の条件を満たすため、中性子発生率の上昇はノックオンテイル形成に因る可能性がある。 T_e(0)≈5 keV おいて ICRF による高速重陽子テイルの形成は確認されていないが[5]、本実験条件 (T_e(0) ≈ 10 keV) においても同様であるか、確認する必要がある。

[1] J. J. Devaney and M. L. Stein, Nucl. Sci. Eng. 46 (1971) 323. [2] H. Matsuura., et al., Nucl. Fusion 61 (2021) 094001. [3] S. Kamio., et al., J. Instrum. 14 (2019) C08002. [4] H. Matsuura., et al., Phys. Plasmas 13 (2006) 062507. [5] R. Seki., et al., J. Plasma Fusion Rea. 15 (2020) 1202088.